Guía docente
220071 - CTMA - Técnicas de Caracterización de Aleaciones Metálicas

Última modificación: 19/04/2023

Unidad responsable: Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
Unidad que imparte: 702 - CEM - Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales.

Titulación:
GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍA Y DISEÑO TEXTIL (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA MECÁNICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA (Plan 2009). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DEL PRODUCTO (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS AEROESPACIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).
GRADO EN INGENIERÍA EN VEHÍCULOS AEROESPACIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2023 **Créditos ECTS:** 3.0 **Idiomas:** Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: MARIA NURIA SALAN BALLESTEROS

Otros:

METODOLOGÍAS DOCENTES

Ver versión en inglés

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Ver versión en inglés

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo	Horas	Porcentaje
Horas grupo grande	30,0	40.00
Horas aprendizaje autónomo	45,0	60.00

Dedicación total: 75 h

CONTENIDOS

título castellano

Descripción:
contenido castellano

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

título castellano

Descripción:
contenido castellano

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

título castellano

Descripción:
contenido castellano

Dedicación: 25h
Grupo grande/Teoría: 10h
Aprendizaje autónomo: 15h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Ver versión en inglés

BIBLIOGRAFÍA

Básica:
- Eaton, Peter Jonathan; West, Paul. Atomic force microscopy. Oxford: Oxford University Press, 2010. ISBN 9780199570454.
- Bermúdez Polonio, Joaquín. Métodos de difracción de rayos X : principios y aplicaciones. Madrid: Pirámide, cop. 1981. ISBN 8436801806.
- Beeston, B. E. P. Electron diffraction and optical diffraction techniques. Amsterdam: North-Holland, 1972. ISBN 0720442532.
- Heimendahl, Manfred von. Electron microscopy of materials : an introduction. New York: Academic Press, 1980. ISBN 0127251502.

Complementaria:
- Cullity, B.D.; Stock, S. R. Elements of X-ray diffraction. 3rd ed. Essex: Pearson, cop. 2014. ISBN 9781292040547.
- Ashby, Michael F; Shercliff, Hugh; Cebon, David. Materials : engineering, science, processing and design. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2014. ISBN 9780080977737.
- Dieter, G. E.; Schmidt, L. C. Engineering design. 6th ed. New York: McGraw-Hill, 2021. ISBN 9781260575279.